

	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	คณะวิทยาศาสตร์	โทรสาร : 02 - 470 - 8900	
	โทรศัพท์: 02 - 470 - 8907	Website : sic.kmutt.ac.th	
	E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th		
อัปเดตข้อมูล		ห้องปฏิบัติการ SMART LAB	
01/06/2023		เครื่องมือวิเคราะห์	
เครื่องมือ	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron Microscope (SEM)		
ความสามารถ	วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุ		
ยี่ห้อ	Jeol		
รุ่น	JCM-7000		
รายละเอียด	สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับผู้วิเคราะห์ได้โดยตรงที่เบอร์ 02-470-9122-4		
ตัวอย่าง	- Polymer, ของแข็ง, ผง, ยา, อาหาร, โลหะ ของแข็งลักษณะเป็นผงแห้งไม่ฟุ้งกระจาย ปริมาณไม่น้อยกว่า 0.5 กรัม - แผ่นฟิล์ม ขนาด ก x ย x ส ไม่เกิน 0.5 x 0.5 x 0.5 cm - ชิ้นงาน ขนาด ก x ย x ส ไม่เกิน 0.5 x 0.5 x 0.5 cm		
การเตรียมตัวอย่าง	-		
เวลาดำเนินการ	7-14 วันทำการ		
ข้อจำกัด	ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีความชื้นสูง และฟุ้งกระจาย		
รายงานผลที่จะได้รับ	ไฟล์รูปภาพในรูปแบบ JPEG, TIFF และ BMP		
เงื่อนไขที่ต้องระบุ เพื่อทำการวิเคราะห์	-		
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	หน่วยงานภายใน และ ภายนอก มจร.	
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง		
	1. ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง 2 ชั่วโมงแรก	1,200 / 2 ชั่วโมงแรก	
	2. หลังจาก 2 ชั่วโมง คิดราคาต่อชั่วโมง	800 / ชั่วโมง	
	3. ค่าบริการเคลือบทอง	500 / ตัวอย่าง	

Scanning Electron Microscope (SEM)

Jeol/JCM-7000

